



# DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA ELETTRONICA, INFORMATICA ED ELETTRICA

IEEE LEOS Italy Chapter



## AVVISO DI SEMINARIO

# Microscopia a stilo: principi ed esempi di applicazione

**Adele Sassella**

Dipartimento di Scienza dei Materiali  
Università di Milano-Bicocca

**Sommario** - In questa presentazione si illustreranno brevemente le moderne tecniche di microscopia a stilo, in particolare la microscopia a effetto tunnel (STM) e la microscopia a forza atomica (AFM). Alcuni esempi serviranno a chiarire i principi di funzionamento delle tecniche stesse e a mostrare risultati scientifici rilevanti, che rendono questi strumenti importanti anche per la diagnostica di componenti e materiali elettronici.

**Mercoledì' 22 aprile, ore 11 -13  
Aula E4**

I dottorandi e tutti gli altri interessati sono cordialmente invitati.

**L'Organizzatore**

Prof. Silvano Donati

**Il coordinatore del Dottorato**

Prof. G Conciauro